

P603-1 / P750 set

Leitungsgebundene HF-Messung nach IEC 61967-4, 1 Ohm / 150 Ohm

LANGER
EMV-Technik



Kurzbeschreibung

Das Probe-Set dient zur Messung der leitungsgebundenen Aussendungen (Messung mit direkter 1 Ohm / 150 Ohm-Kopplung) nach IEC 61967-4 an IC-Pins. Für die Strom- und Spannungsmessung steht jeweils eine Probe zur Verfügung. Jedes Pin des Test-ICs kann mit der Probe erreicht und kontaktiert werden.

Die Messungen mit dem Probe Set gewährleisten eine hohe Wiederholpräzision und Vergleichbarkeit der Messungen. Zur Inbetriebnahme des Test-ICs dient die IC-Testumgebung ICE1 der Langer EMV-Technik. Die Messungen können mit der Software ChipScan-ESA durchgeführt werden. Die in der Software gespeicherten Messergebnisse aller gemessener Pins können schnell und systematisch verglichen werden.

Lieferumfang

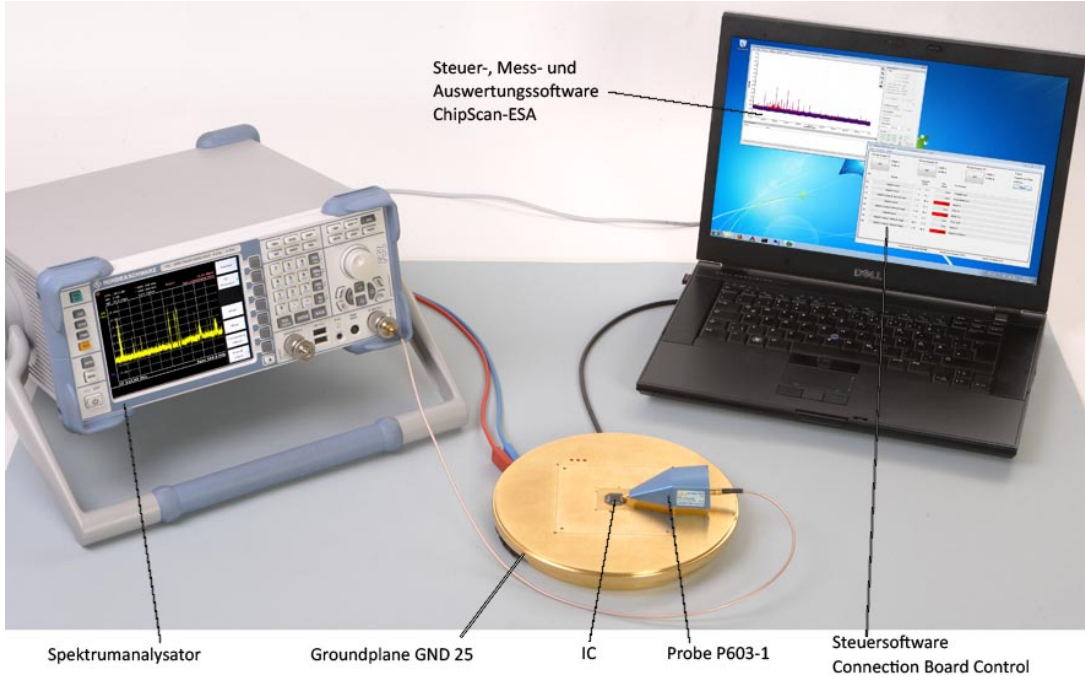
- 1x P603-1, HF-Strommesser 1 Ohm
- 1x P750, HF-Spannungsmesser 150 Ohm
- 1x CS-ESA, Software ChipScan-ESA / USB
- 1x SMA-SMB 1 m, Messkabel SMA-SMB
- 1x NT FRI EU, Steckernetzteil
- 1x P603 / P750 case, Systemkoffer
- 1x P603-1 / P750 m, Benutzerhandbuch P603 / P750 Set

P603-1 / P750 set

Leitungsgebundene HF-Messung nach IEC 61967-4, 1 Ohm / 150 Ohm



Anwendung mit P603-1



Schema Messaufbau mit P750

